

名称	型番	用途	特徴
卓上走査電子顕微鏡	TM3030plus	外観観察	50倍～25000倍程度、焦点深度が深く立体的な画像が得られる。
エネルギー分散型X線分析装置	Quantax70	異物元素分析	ボロン(B)からの軽元素分析。点分析、線分析、マッピング分析が可能。
半導体デバイスアナライザ	B1500A	電気特性解析	I-V測定、C-V測定、ウエハPCM測定
マニュアルプローバー	MX-1000B	高低温プロービング	8インチウエハ対応、-40℃～200℃サーモチャック付き